# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-142634

(43) Date of publication of application: 02.06.1995

(51)Int.CI.

H01L 23/12 H05K 13/04

(21)Application number: 05-289575

(71)Applicant: IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing:

18.11.1993

(72)Inventor: WAKIHARA YOSHINORI

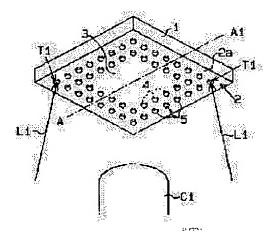
**TOYONAGA HIROHIDE** 

# (54) MOUNTING OF SURFACE MOUNT COMPONENT

### (57)Abstract:

PURPOSE: To mount easily an electronic component mount device, which has pads formed with bumps and the like on the surface on the side to be mounted, and a surface mount component, such as a semiconductor chip, on a printed—wiring board and at the same time, to reduce the cost for the development of a device to mount the surface mount component.

CONSTITUTION: First laser beams L1 are respectively emitted on diagonal positions T1 of bumps 5 of a ball grid array 1. Then, the array 1 is moved front an emission surface A-A1 and second laser beams are respectively emitted on the surface A-A1 via filters frog the opposite directions to the emitted directions of the beams L1. Then, the filters are moved and a printed—wiring board is arranged on the surface A-A1 in such a way that the second laser beams are emitted on diagonal positions of pads for mounting of the printed—wiring board being made to correspond to the emitted parts of the bumps 5 emitted with the first laser beams



L1. After the array 1 is again returned to the former surface A-A1, each bump 5 of the array 1 is bonded on each pad for mounting of the board.

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-142634

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 23/12 H05K 13/04

M

H01L 23/12

L

# 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平5-289575

(71)出願人 000000158

イビデン株式会社

(22)出顧日

平成5年(1993)11月18日

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72)発明者 脇原 義範

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

(72)発明者 豊永 博英

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン 株式会社大垣北工場内

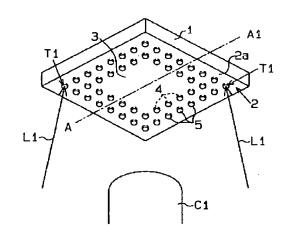
(74)代理人 弁理士 恩田 博宜

#### (54) 【発明の名称】 表面実装部品の実装方法

### (57)【要約】

【目的】実装する側の面にバンブ等が形成されたバッドを有する電子部品搭載装置や半導体チップ等の表面実装部品をプリント配線板に容易に実装するとともに、表面実装部品を実装する装置の開発にかかるコストを低減する。

【構成】ボール・グリッド・アレイ1のバンプ5の対角位置T1に第1のレーザー光L1を照射する。次にボール・グリッド・アレイ1を当該照射面A-A1から移動させ、その照射面A-A1にフィルタを介して第2のレーザー光を第1のレーザー光L1の照射方向と反対方向からそれぞれ照射する。次いでフィルタを移動させてブリント配線板をその実装用バッドの対角位置に第2のレーザー光が第1のレーザー光L1が照射されたバンプ5の照射部分と対応させて照射されるように照射面A-A1に配置する。そして、再びボール・グリッド・アレイ1を元の照射面A-A1に戻した後、ボール・グリッド・アレイ1の各バンプ5とプリント配線板の各実装用バッドとを接合する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面実装部品の実装面に形成された複数 のパッド及び回路基板に形成された前記パッドに対応す る実装用バッドのいずれか一方の少なくとも任意の2箇 所に第1のスポット光を照射し、次に前記表面実装部品 及び回路基板のいずれか一方を当該照射位置から移動さ せ、その第1のスポット光の照射位置に第2のスポット 光を第1のスポット光の照射方向と反対方向からそれぞ れ照射し、次いで前記第1のスポット光が照射されなか ったバッド及び実装用バッドのいずれか一方の少なくと も任意の2箇所に第2のスポット光を前記第1のスポッ ト光が照射されたバッド及び実装用バッドのいずれかー 方の照射部分と対応させて照射し、再び表面実装部品又 は回路基板いずれか一方を元の第1のスポット光の照射 位置に戻した後、表面実装部品の各パッドと回路基板の 各実装用パッドとを接合するようにしたことを特徴とす る表面実装部品の実装方法。

1

【請求項2】 複数のバッドを備えた表面実装部品をそのバッドと回路基板の実装用バッドとを対応させて同回路基板に実装する方法であって、

前記表面実装部品は、その少なくとも任意の2箇所のバッドが形成された面と対応する反対側の面に印がそれぞれ形成されており、

前記表面実装部品の各印及び回路基板の少なくとも任意の2箇所の実装用バッドのいずれか一方にスポット光をそれぞれ照射し、次に表面実装部品及び回路基板のいずれか一方を当該照射位置から移動させ、そのスポット光の照射位置にスポット光が照射されなかった各印及び少なくとも任意の2箇所の実装用バッドのいずれか一方をスポット光が照射された各印及び実装用バッドのいずれ 30か一方の照射部分と対応させて位置決めし、再び表面実装部品及び回路基板のいずれか一方を元のスポット光の照射位置に戻した後、表面実装部品のバッドと回路基板の実装用バッドとを接合するようにしたことを特徴とする表面実装部品の実装方法。

【請求項3】 複数のバッドを備えた表面実装部品をそのバッドと回路基板の実装用バッドとを対応させて同回路基板に実装する方法であって、

前記表面実装部品のパッド及び回路基板の実装用パッドいずれか一方は、その少なくとも任意の2箇所の部分が 部品及び基板のいずれか一方の反対側の面にまで貫通除 去されており、

前記表面実装部品及び回路基板のいずれか一方の貫通除 去された各部分へのスポット光の通過と、その貫通除去 された各部分と対応する残りのバッド及び実装用バッド のいずれか一方へのスポット光の照射とを行って両バッ ドを位置決めした後、表面実装部品のバッドと回路基板 の実装用バッドとを接合するようにしたことを特徴とす る表面実装部品の実装方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は表面実装部品の実装方法 に係り、詳しくは半導体チップ等の電子部品を搭載した 基板の実装面にバンプ等が形成されたパッドを有する電 子部品搭載装置、及び同様に実装面にバンプ等が形成さ れたパッドを有する半導体チップ等の表面実装部品のプ リント配線板への実装方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、高性能化に伴い半導体チップ(ベアチップ)等の電子部品を搭載した電子部品搭載装置等の部品のプリント配線板(マザーボード)への表面実装化が進んでいる。

【0003】 この種の表面実装部品としてはQFP(クアッデッド・フラット・パッケージ)等に代表されるように、所謂リードフレームを使用した半導体パッケージが主流を占めている。しかしながら、ICの高集積化とともに端子数の増加、インナーリードと接続されるICチップの接続ピッチの狭ピッチ化が進むと、エッチング等で形成されるリードフレームでは、多ピン化、狭ピップを搭載するプリント配線板の裏面にパッドを形成し、そのパッドに半田よりなる半球状のパンプを形成したBGA(ボール・グリッド・アレイ)等が多ピン化による小型化に適した半導体パッケージとして注目されている。

【0004】とのBGAはバンブをブリント配線板上の実装用バッドにリフロー半田付けすることにより、ブリント配線板の表面に実装されるようになっている。BGAを表面実装するには、一般的に半田あるいは半田及びフラックスでコートされたブリント配線板上の実装用バッドに、BGAのバンブを位置決めして、接着剤等により仮固定した後、リフロー炉にて加熱して半田付けするようにしている。従って、リフロー半田付けするにあたっては、BGAのバンブとブリント配線板上の実装用バッドとの正確な位置決めが要求される。

【0005】従来、BGA等の半導体パッケージの実装 装置では、カメラを用いてバンプと実装用バッドとを観 察して位置決めするようにしている。すなわち、図2 1、図22に示すように、BGA50の下側からバンプ 51をカメラ52にて観察し、プリント配線板53の上 方から実装用バッド54を別のカメラ55にて観察する ようにしている。そして、カメラ52、55が認識した バンプ51と実装用パッド54との画像データを基に座 標値を演算し、その座標値に基づいてBGA50をプリ ント配線板53に機械的に位置決めしてから実装するよ うにしている。

【0006】又、表面実装部品としての半導体バッケージにおいては、その半導体バッケージを構成する半導体チップをプリント配線板に表面実装するようにしたもの50 もある。例えば、複数個のベアチップをプリント配線板

3

に搭載する所謂MCM(マルチ・チップ・モジュール)と呼ばれる装置においては、フリップチップボンディングによりベアチップをプリント配線板に直接実装している。すなわち、フリップチップボンディングはベアチップの一面のバッドに形成されたバンプと、プリント配線板に形成された実装用バッドとを半田付け等により電気的に接続するという方法である。従って、このフリップチップボンディングにおいても、上記したBGAと同様にカメラを用いた観察によりベアチップをプリント配線板の実装用バッド上に位置決めして実装するようにして10いる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記したB GA50等の半導体パッケージやベアチップの実装方法 では、次のような問題がある。

【0008】従来の画像認識方法では、BGA50を観察するカメラ52とプリント配線板53を観察するカメラ55とを必要とする。又、画像データを基にBGA50の各バンプ51の座標値と、プリント配線板53の各実装用バッド54の座標値とを演算するようにしているので、その演算処理プログラムの作成や演算処理回路の設計に時間がかかるとともに、装置自体が複雑なものとなるという問題がある。このため、装置の開発に時間がかかって開発コストが多大なものとなる。このことは、カメラを用いたベアチップの実装においても同様な問題となる。

【0009】本発明は上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は実装する側の面にバンプ等が形成されたバッドを有する電子部品搭載装置や半導体チップ等の表面実装部品をブリント配線板に容易に実装することができるとともに、表面実装部品を実装する装置の開発にかかるコストを低減することができる表面実装部品の実装方法を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた め請求項1に記載の発明では、表面実装部品の実装面に 形成された複数のパッド及び回路基板に形成された前記 パッドに対応する実装用パッドのいずれか一方の少なく とも任意の2箇所に第1のスポット光を照射し、次に前 記表面実装部品及び回路基板のいずれか一方を当該照射 位置から移動させ、その第1のスポット光の照射位置に 第2のスポット光を第1のスポット光の照射方向と反対 方向からそれぞれ照射し、次いで前記第1のスポット光 が照射されなかったパッド及び実装用パッドのいずれか 一方の少なくとも任意の2箇所に第2のスポット光を前 記第1のスポット光が照射されたパッド及び実装用パッ ドのいずれか一方の照射部分と対応させて照射し、再び 表面実装部品又は回路基板いずれか一方を元の第1のス ポット光の照射位置に戻した後、表面実装部品の各パッ ドと回路基板の各実装用パッドとを接合するようにし

た。

【0011】請求項2に記載の発明では、複数のバッド を備えた表面実装部品をそのバッドと回路基板の実装用 パッドとを対応させて同回路基板に実装する方法であっ て、前記表面実装部品は、その少なくとも任意の2箇所 のパッドが形成された面と対応する反対側の面に印がそ れぞれ形成されており、前記表面実装部品の各印及び回 路基板の少なくとも任意の2箇所の実装用パッドのいず れか一方にスポット光をそれぞれ照射し、次に表面実装 部品及び回路基板のいずれか一方を当該照射位置から移 動させ、そのスポット光の照射位置にスポット光が照射 されなかった各印及び少なくとも任意の2箇所の実装用 パッドのいずれか一方をスポット光が照射された各印及 び実装用パッドのいずれか一方の照射部分と対応させて 位置決めし、再び表面実装部品及び回路基板のいずれか 一方を元のスポット光の照射位置に戻した後、表面実装 部品のパッドと回路基板の実装用パッドとを接合するよ うにした。

【0012】請求項3に記載の発明では、複数のバッドを備えた表面実装部品をそのバッドと回路基板の実装用バッドとを対応させて同回路基板に実装する方法であって、前記表面実装部品のバッド及び回路基板の実装用バッドいずれか一方は、その少なくとも任意の2箇所の部分が部品及び基板のいずれか一方の反対側の面にまで貫通除去されており、前記表面実装部品及び回路基板のいずれか一方の貫通除去された各部分へのスポット光の通過と、その貫通除去された各部分と対応する残りのバッド及び実装用バッドのいずれか一方へのスポット光の照射とを行って両バッドを位置決めした後、表面実装部品のバッドと回路基板の実装用バッドとを接合するようにした。

### [0013]

30

【作用】請求項1に記載の発明では、表面実装部品の実 装面に形成された複数のバッド及び回路基板に形成され た前記バッドに対応する実装用バッドのいずれか一方の 少なくとも任意の2箇所に第1のスポット光が照射され る。次に前記表面実装部品及び回路基板のいずれか一方 が当該照射位置から移動され、その第1のスポット光の 照射位置に第2のスポット光が第1のスポット光の照射 方向と反対方向からそれぞれ照射される。次いで前記第 1のスポット光が照射されなかったパッド及び実装用パ ッドのいずれか一方の少なくとも任意の2箇所に第2の スポット光が前記第1のスポット光が照射されたパッド 及び実装用バッドのいずれか一方の照射部分と対応させ て照射される。そして、再び表面実装部品又は回路基板 いずれか一方が元の第1のスポット光の照射位置に戻さ れた後、表面実装部品の各パッドと回路基板の各実装用 パッドとが接合される。従って、カメラにより表面実装 部品のバッドや回路基板の実装用バッドを観察して座標 50 値を演算処理するためのプログラムを作成したり演算処

理回路の設計をする必要がなくなる。

【0014】請求項2に記載の発明では、少なくとも任 意の2箇所のパッドが形成された面と対応する反対側の 面に印がそれぞれ形成された表面実装部品が用いられ、 表面実装部品の各印及び回路基板の少なくとも任意の2 箇所の実装用パッドのいずれか一方にスポット光がそれ ぞれ照射される。次に表面実装部品及び回路基板のいず れか一方が当該照射位置から移動される。続いて、その スポット光の照射位置にスポット光が照射されなかった 各印及び少なくとも任意の2箇所の実装用パッドのいず れか一方がスポット光を照射した各印及び実装用パッド のいずれか一方の照射部分と対応した位置決めされる。 そして、再び表面実装部品及び回路基板のいずれか一方 が元のスポット光の照射位置に戻された後、表面実装部 品のパッドと回路基板の実装用パッドとが接合される。 従って、一方向からのスポット光の照射により表面実装 部品の実装が簡単に行われる。

【0015】請求項3に記載の発明では、バッド及び実 装用パッドのいずれか一方の少なくとも任意の2箇所の 部分が部品及び基板のいずれか一方の反対側の面にまで 20 貫通除去された表面実装部品及び回路基板のいずれかー 方が用いられる。そして、表面実装部品及び回路基板の いずれか一方の貫通除去された各部分へのスポット光の 通過と、その貫通除去された各部分と対応する残りのパ ッド及び実装用バッドのいずれか一方へのスポット光の 照射とが行われて両パッドが位置決めされる。その後、 表面実装部品のバッドと回路基板の実装用バッドとが接 合される。この結果、貫通除去された各部分を通過した スポット光による各バッド及び各実装用バッドのいずれ か一方への照射により表面実装部品と回路基板との位置 30 決めが確実に行われる。

[0016]

【実施例】 (実施例1)以下、本発明をBGA (ボール ・グリッド・アレイ)のプリント配線板への実装方法に 具体化した実施例1を図1~図5に従って説明する。最 初にBGAとプリント配線板の構成について簡単に説明 する。

【0017】図1において、表面実装部品としてのBG A1は表面に図示しないLSIチップを搭載したプリン ト配線板2を備えており、そのブリント配線板2の裏面 2aがBGA1の実装面となっている。そのプリンント 配線板2の裏面2a中央部の非形成領域3を除く周囲に は、複数のパッド(破線にて図示)4が等間隔に形成さ れるとともに、その各パッド4上には、半田よりなる半 球状のバンプ5がそれぞれ形成されている。

【0018】図4に示すように、回路基板としてのガラ ス・エボキシ製のプリント配線板6の表面には前記バン ブ5に対応するBGA1の実装用パッド7が等間隔にて 複数配設されている。又、この実装用バッド7には予め の代わりに、半田等よりなるバンプを形成してもよい。 【0019】次に、上記のように構成されたBGA1を プリント配線板6に実装する方法を図1〜図5に従って 説明する。BGA1をバンプ5が下側となるように図示 しない吸引装置により吸着して照射位置としての照射面 A-A1 に配置した状態で、バンブ5の対角位置T1 に 第1のスポット光としての第1のレーザー光L1 を照射 する(図1)。このとき、第1のレーザー光L1はBG A1の下方に配置された第1のカメラC1 のバンプ5の 観察に基づいて、図1に示すバンブ5の対角位置T1 に それぞれ照射される。又、この第1のレーザー光L1 は バンプ5の径よりも若干小さなスポット径(例えば、1 00 um)を有しており、図示しないフィルタの使用に より照射の際に乱反射を引き起こすことのない出力とな っている。次に、第1のレーザー光L1をバンプ5の対 角位置T1 に照射した状態で固定し、BGA1を上方の 待機位置(図示せず)に前記照射面A-A1 と平行とな るように移動させる。

【0020】続いて、前記照射面A-A1に、第1のレ ーザー光L1 を吸収するガラス製の板状のフィルタ8を 図示しない保持装置により保持した状態で挿入して、そ のフィルタ8に第1のレーザー光L1 をそれぞれ照射さ せる(図2)。このとき、フィルタ8上には第1のレー ザー光L1 の照射によるスポットSがそれぞれ現れてい

【0021】この状態で、第2のレーザー光L2を第1 のレーザー光L1 の照射方向と反対方向からスポットS に対してそれぞれ照射して位置決めする(図3)。この とき、第2のレーザー光L2 は、フィルタ8の斜め上方 に配置された第2のカメラC2の観察に基づいて、スポ ットSにそれぞれ照射される。との第2のカメラC2は BGA1の上方への移動時及び第2のレーザー光L2 の 照射時において互いに干渉しない位置に配置されてい る。続いて、第1のレーザー光し1の照射を停止し、第 2のレーザー光L2 を各スポットSにそれぞれ位置決め した状態で、フィルタ8を照射面A-A1 から移動させ る。

【0022】次に、照射面A-A1 にプリント配線板6 をその実装用パッド7の対角位置T2 に第2のレーザー 光L2 が照射されるように配置する(図4)。 このと き、ブリント配線板6は第2のカメラC2の実装用パッ ド7の観察に基づいて、第2のレーザー光L2が実装用 バッド7の対角位置T2 にそれぞれ照射されるように配 置される。

【0023】次に、待機位置にBGA1が待機している 状態で、図4に示すプリント配線板6の非実装用パッド 形成領域7aに接着剤(図示せず)を塗布した後、その BGA1を下方の照射面A-A1まで移動させてブリン ト配線板6に接着する(図5)。このとき、各バンプ5 図示しない半田皮膜が形成されている。なお、半田皮膜 50 は各実装用パッド7上にそれぞれ確実に位置決めされて いる。そして、BGA1が接着されたプリント配線板6を、図示しないリフロー炉内に投入して加熱する。すると、半田よりなるバンプ5と実装用パッド7上の図示しない半田が溶融してバンブ5と実装用パッド7とが接合されて、BGA1のプリント配線板6への実装が完了する。

【0024】上記したように本実施例におけるBGA1の実装方法によれば、対角位置T1にあるバンブ5に照射された第1のレーザー光L1にフィルタ8を介して第2のレーザー光L2を一致させ、その第2のレーザー光 10 L2を対角位置T2にある実装用パッド7に照射するようにした。この方法により各バンブ5を各実装用パッド7上にそれぞれ確実に位置決めして接合することができる。そして、バンブ5と実装用パッド7との位置決めに際して第1のカメラC1は、第1のレーザー光L1のバンブ5への照射状況を観察し、第2のカメラC2は、第2のレーザー光L2のスポットS及び実装用パッド7への照射状況を観察するだけでよくなる。

【0025】従って、カメラの観察に基づいて、BGA 1のパンプ5やプリント配線板2の実装用パッド7の座標値を演算処理するためのプログラムを作成したり演算処理回路の設計をする必要がなくなる。この結果、第1及び第2のレーザー光L1、L2を照射する位置を調節したり、BGA1やプリント配線板2を移動させたりする機構が必要となるだけで装置自体を簡単な構成とすることができる。又、構成が簡単となることで、装置の開発時間が短くなって開発コストを低減することができるとともに、安価な実装装置の実現が可能となる。

【0026】又、この方法を実施する実装装置を作製した場合、機械的な構成が大半を占めることになるため、扱い易くかつメンテナンスが簡単となる。更に、この実装方法では、第1及び第2のレーザー光L1、L2の照射状況をカメラC1、C2により観察する際に、そのバンプ5や実装用パッド7等の汚れ等による影響を受けにくくなる。

[0027] (実施例2)次に、実施例2を図6〜図1 3に従って説明する。この実施例ではBGA1の構成及 びそのBGA1の実装方法が前記実施例1と異なる。

【0028】図7に示すように、BGA1を構成するガラス・エポキシ製の多層ブリント配線板10の中央には 40 LSIチップ11が搭載されており、そのLSIチップ11の周囲には導体回路12が形成されている。多層ブリント配線板10には複数のスルーホール13a, 13 bが形成されており、そのスルーホール13a, 13 bが形成されており、そのスルーホール13a, 13 bを介して前記導体回路12と、多層プリント配線板10の反対側の面に形成された導体回路14とが電気的に接続されている。多層プリント配線板10の導体回路14と同じ面には、複数のパッド15aが形成されており、導体回路14と電気的に接続されている。そして、各パートによりにはが批けの光田とのなるパンプ16aが 50

それぞれ形成されている。図6、図7に示すように、BGA1の対角位置T3に形成された一対の前記スルーホール13bの孔部17には、アディティブ用樹脂18が充填されている。そして、そのアディティブ用樹脂18のLSIチップ11側の端面18aには、孔部17内において白色のインクよりなる印19が形成されている。この印19はレーザー光を照射するに十分な径(この場合、300μm)を有しており、かつカメラにて視認可能となっている。又、アディティブ用樹脂18の前記バンプ16a側の端面18b及びスルーホール13bのランド20bには、パッド15bが形成されている。そのパッド15b上にバンプ16bが形成されている。位って、前記印19とパッド15bすなわちバンプ16bとは互いに対応関係にある。又、バンプ16bとバンプ16aとの高さは等しくなっている。

【0029】次に、上記のように構成されたBGA1をプリント配線板6に実装する方法を図8~図10に従って説明する。BGA1を照射面A-A1に配置した状態で、その対角位置T3に形成された各印19にレーザー光Lをその上方からBGA1に対して垂直方向にそれぞれ照射する(図8)。このとき、レーザー光Lは、BGA1の斜め上方に配置されたカメラCの観察に基づいて印19に照射される。又、このレーザー光Lのスポット径は100 $\mu$ mとなっている。次に、レーザー光Lを照射した状態で、BGA1を上方の待機位置(図示せず)に前記照射面A-A1と平行となるように移動させた後、所定角度だけ回転させる。

【0030】続いて、前記照射面A-A1 にプリント配線板6をその実装用バッド7の対角位置T2 にレーザー30 光Lが照射されるように配置する(図9)。このとき、プリント配線板6はカメラCの観察に基づいて、レーザー光Lが印19すなわちバンプ16bに対応した実装用バッド7の対角位置T2 にそれぞれ照射されるように配置される。

【0031】次に、ブリント配線板6の非実装用パッド形成領域7aに接着剤を塗布した後、そのBGA1を所定角度だけ逆方向へ回転させて元の位置へ戻した後、下方の照射面A-A1へ移動させてブリント配線板6に接着する(図10)。このとき、バンブ16a,16bは各実装用パッド7上にそれぞれ確実に位置決めされている。そして、BGA1が接着されたブリント配線板6を、図示しないリフロー炉内に投入してバンブ16a,16bと実装用パッド7とを接合して、BGA1の実装が完了する。

り形成される。

ィブ用樹脂18を充填したことにより、印19と対応す るパッド15bすなわちバンプ16bを形成することが できる。又、印19を白色のインクにて形成したことに より、スルーホール13bのランド20a端面とのコン トラストが明確となり、カメラCによる観察が容易とな

【0033】次に、BGA1のスルーホール13bにバ ッド15bを形成する工程について図11~図13に従 って簡単に説明する。常法により多層プリント配線板 1 0 に形成されたスルーホール13bの孔部17にエポキ シ樹脂を主成分とするアディティブ用樹脂 18をディス ベンサにより充填した後、硬化させる。続いて、バンブ 16 bを形成すべきアディティブ用樹脂18の端面18 bを除いた多層プリント配線板10の両面に耐熱性の感 光性樹脂からなるメッキレジスト層Rを形成する。次 に、アディティブ用樹脂18の端面18bをクロム酸、 過マンガン酸等にて粗化した後、パラジウム等の核触媒 を付与して活性化処理を施す(図11)。

【0034】その後、無電解銅メッキを施して銅メッキ 層21を形成する(図12)。続いて、メッキレジスト 層Rを剥離した後、銅メッキ層21及び銅メッキ層21 と隣接するスルーホール13bのランド20bにNi電 解メッキを施してNi層22を形成する。さらに、Ni 層22の上にAu電解メッキを施してAu層23を形成 してバッド15bの形成が完了する。その後、他のバッ ド15aとともにパッド15b上に半田よりなる半球上 のバンプ16a, 16bを形成する(図13)。

【0035】(実施例3)次に、実施例3を図14~図 18に従って説明する。この実施例では表面実装部品と してのLSI(ラージ・スケール・インテグレイテッド サーキット)チップをプリント配線板へ実装するように した。

【0036】図14に示すように、LSIチップ30の 実装面である能動素子面31の中央部の非形成領域32 を除く周縁には、複数のパッド33が等間隔に形成され ており、その各パッド33上には半球状のバンブ34が それぞれ形成されている。この各バンプ34は半田より なり、その直径は150μmとなっている。又、図1 4, 図15に示すように、前記能動素子面31の対角位 置T4 におけるバンプ(二点鎖線にて図示)34が形成 されるべき角部には切欠溝35が形成されている。との 切欠溝35はLSIチップ30の対角位置T4 におい て、内側へパッド33の面積を含む円弧状で、かつ前記 能動素子面31とは反対側の面まで切欠き除去されてい る。又、切欠溝35はスポット径が100 μmのレーザ 一光が通過できるようになっている。この切欠溝35は 図16に示すように、ウェハー39からLSIチップ3 0をダイシング加工により多数個取りで製造する前に、 各LSIチップ30の対角位置T4を小径(この場合、 300µm)のドリルを用いて孔あけ加工することによ 50 3では表面実装部品としてLSIチップ30を使用した

【0037】図18に示すように、前記LSIチップ3 0を実装するプリント配線板36は、LSIチップ30 の各バンプ34に対応した実装用パッド37が形成され るとともに、前記切欠溝35に対応する位置にダミーバ ッド38がそれぞれ形成されている。このダミーパッド 38は実装用バッド37の配置間隔と同じ間隔で形成さ れており、レーザー光による位置合わせに用いられる。

又、実装用バッド37には図示しない半田皮膜が形成さ 10 れている。なお、実装用バッド37に半田皮膜の代わり にバンプを形成してもよい。

【0038】次に、上記のように構成されたLSIチッ ブ30をブリント配線板36に実装する方法を説明す る。LSIチップ30をその能動素子面31を下にして 配置した状態で、その対角位置T4 に形成された各切欠 溝35内を通過するようにレーザー光Lを、その上方か **らLSIチップ30に対して垂直方向にそれぞれ照射す** る(図17)。このとき、レーザー光Lは、LSIチッ ブ30の斜め上方に配置されたカメラCの観察に基づい 20 て切欠溝35に接触しないように照射される。

【0039】次に、レーザー光しが照射された状態で、 LSIチップ30の下側にプリント配線板36をそのダ ミーパッド38にレーザー光しがそれぞれ照射されるよ うに所定間隔にてLSIチップ30と平行に配置する (図18)。このとき、プリント配線板36はカメラC の観察に基づいて、レーザー光しが切欠溝35を接触せ ずに通過して、ダミーパッド38にそれぞれ照射される ように配置される。そして、プリント配線板36の非パ ッド形成領域36aに接着剤を塗布した後、そのLSI チップ30を下方に移動させてプリント配線板6に接着 30 する。このとき、レーザー光しをバッド33となる角部 に形成された切欠溝35を通過させてダミーバッド38 に照射しているため、各バンプ34は各実装用パッド3 7上にそれぞれ確実に位置決めされる。そして、LSI チップ30が接着されたプリント配線板6を、図示しな いリフロー炉内に投入してバンプ34と実装用パッド3 7とを接合して、LSIチップ30の実装が完了する。 【0040】上記したように、実施例3においては、L SIチップ30の対角位置T4の角部に切欠溝35をそ 40 れぞれ形成した簡単な構成で、その切欠溝35を通過し たレーザー光しにより、LSIチップ30とプリント配 線板36との位置決め及び実装を確実に行うことができ

【0041】なお、本発明は上記実施例のみに限定され ることはなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で例えば 以下のようにしてもよい。

(1)上記実施例1及び実施例2では、表面実装部品と してBGA1を使用したが、代わりに実装面にバンブが 形成された半導体チップを使用してもよい。又、実施例 が、かわりにBGA等を使用してもよい。この場合、BGA等おいては、LSIチップ30のように切欠溝35を形成したり、貫通孔等を形成してもよい。

【0042】(2)上記実施例1では、バンブ5の対角位置T1に第1のレーザー光L1を照射し、実装用バッド7の対角位置T2に第2のレーザー光L2を照射するようにしたが、他の任意の2点に照射するようにしてもよい。又、レーザー光を照射する順序を変えて、最初に実装用バッド7の対角位置T2に第1のレーザー光L1を照射した後、バンブ5の対角位置T1に第2のレーザ 10一光L2を照射するようにしてもよい。

【0043】(3) 実施例2では、BGA1の対角位置 T3 に形成された一対のスルーホール13bを利用して 印19を形成したが、BGA1のプリント基板10の他 の任意の2点に実装用パッド7と対応して形成されたスルーホールを利用してもよい。又、レーザー光を照射する順序を変えて、最初に実装用パッド7の対角位置T2 にレーザー光Lを照射した後、各印19にレーザー光Lを照射するようにしてもよい。

【0044】(4)実施例3において、切欠溝35を形 20 成する部分はLSIチップ30の対角位置T4でなく他の任意の2箇所であってもよい。又、LSIチップ30に切欠き溝35を形成する代わりに、プリント配線板36の実装用パッド37となる任意の2箇所に貫通孔を形成して、LSIチップ30のバンプ34と位置合わせするようにしてもよい。

【0045】(5)実施例1~3において、レーザー光の代わりにスリット光を用いてもよい。この場合、スリット幅をバンプの径に応じて調整できることが好ましい。

(6) 実施例2において、BGA1の対角位置T3に形成された一対のスルーホール13bを利用して印19を形成する場合、アディティブ用樹脂18の代わりに、図19に示すように、金属製のピン40をスルーホール13bに挿入してもよい。とのピン40はその一端に円板状のパッド15bが一体に形成され、他端に印19が貼着されている。そして、ピン40はスルーホール13bに挿入されるとともに、パッド15bがランド20bと接触した状態で半田付けされている。とのような構成にすると、スルーホール13bに印19やパッド15bを40簡単に形成することができる。

【0046】(7) 実施例3ではLSIチップ30のパッド33に形成されたバンプ34を実装用バッド37に接合するようにしたが、代わりに、図20に示すように、図示はしないがパッド33にバンプ34を形成せずに、ポリイミド等よりなるフィルム41の両面にバンプ(片面のみ図示)42が連続して形成された接合フィルム43を介して接合するようにしてもよい。この接合フィルム43を使用する場合、LSIチップ11の切欠溝35を通過したレーザー光Lがダミーバッド38にそれ50

12

ぞれ照射された状態で、LSIチップ11とブリント配線板36との間に接合フィルム43を挿入する。このとき、接合フィルム43は切欠溝35及びダミーパッド38と対応する位置に形成されたダミーパンプ42aにレーザー光しが照射されるように挿入される。

[0047] (8) 実施例3では、LSIチップ30を プリント配線板36に実装するようにしたが、代わり に、TAB (テープ・オートメイテッド・ボンディン グ) テープに実装するようにしてもよい。

[0048](9)上記実施例1~3ではバンプ5,3 4と実装用バッド7,37とを半田をリフローさせて接合するようにしたが、超音波法等他の方法により接合するようにしてもよい。

【0049】(10) BGA1やLS1チップ30以外の表面実装部品として、表面実装が可能な比較的短いピンを備えた表面実装型PGA(ピン・グリッド・アレイ)、ICチップの他に抵抗、コンデンサ等のチップ部品を搭載した表面実装型ハイブイッドIC等に適用してもよい。

0 【0050】(11) BGA1を構成するプリント配線 板2の裏面2aやLSIチップ30の能動素子面31の 全体にパッド4,33を形成し、そのパッド4,33に バンプ5,34を形成したものを使用してもよい。

【0051】(12)フィルタ8をガラス製の代わりに 合成樹脂製としてもよい。

[0052]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば実 装する側の面にバンブ等が形成されたパッドを有する電 子部品搭載装置や半導体チップ等の表面実装部品をプリ 30 ント配線板に容易に実装することができるとともに、表 面実装部品を実装する装置の開発にかかるコストを低減 することができるという優れた効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1におけるBGAのバンプに第 1のレーザー光を照射した状態を示す斜視図である。

【図2】同じく、BGAを移動させた後、フィルタに第 1のレーザー光を照射した状態を示す斜視図である。

【図3】フィルタに第2のレーザー光を第1のレーザー 光とは反対側から照射した状態を示す斜視図である。

【図4】第2のレーザー光をプリント配線板の実装用パッドに照射した状態を示す斜視図である。

【図5】BGAをプリント配線板に実装した状態を示す 斜視図である。

【図6】実施例2におけるBGAを示す斜視図である。

【図7】同じく、BGAを示す断面図である。

【図8】BGAの各印にレーザー光を照射した状態を示す斜視図である。

【図9】レーザー光をブリント配線板の実装用パッドに 照射した状態を示す斜視図である。

o 【図10】BGAをプリント配線板に配置した状態を示

す斜視図である。

【図11】BGAの印を形成するためのスルーホールに アディティブ用樹脂を充填した状態を示す一部模式断面 図である。

13

【図12】アディティブ用樹脂の端面に銅メッキ層を形成した状態を示す一部模式断面図である。

【図13】スルーホールのランド及び銅メッキ層にNi 及びAu層を形成し、そのAu層(パッド)にバンプを 形成した状態を示す一部模式断面図である。

【図14】実施例3におけるLSIチップを示す斜視図 である。

【図15】LSIチップを示す一部拡大平面図である。

【図16】切欠溝の形成工程を示す模式平面図である。

【図17】LSI5まっプの切欠溝にレーザー光を通過させた状態を示す斜視図である。

【図18】レーザー光をプリント配線板の実装用バッド に照射した状態を示す斜視図である。 \* 【図19】他の実施例における印を形成するスルーホールにピンを挿入したBGAを示す一部模式断面図である

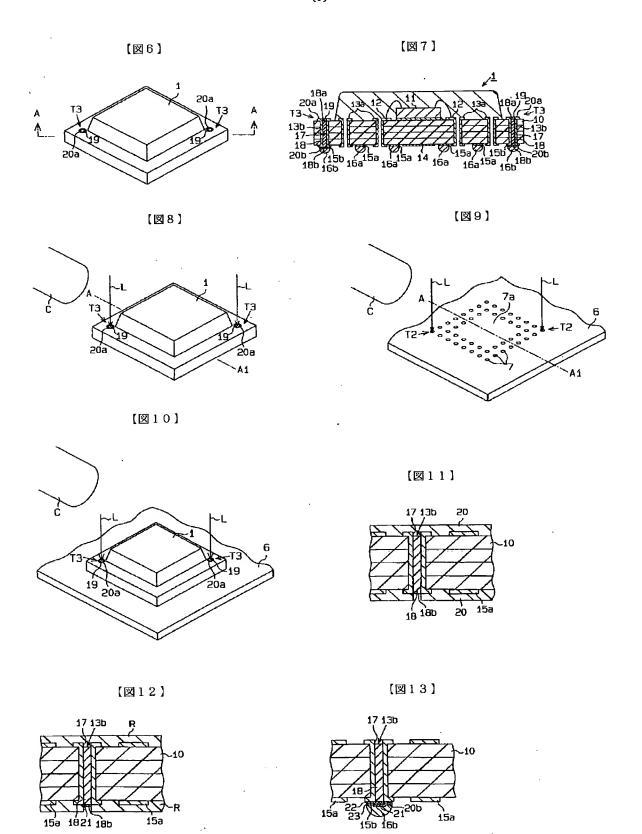
[図20]他の実施例におけるLSIチップとプリント 配線板との間に接合フィルムを挿入する状態を示す斜視 図である。

【図21】従来例におけるカメラによりBGAの実装面 を観察している状態を示す斜視図である。

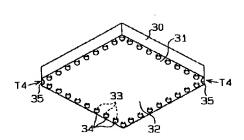
【図22】同じく、別のカメラによりプリント配線板を 10 観察している状態を示す斜視図である。

## 【符号の説明】

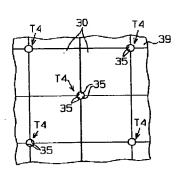
1…表面実装部品としてのBGA(ボール・グリッド・アレイ)、2 a…実装面としての裏面、4, 15 b, 3 3…パッド、6, 3 6…回路基板としてのプリント配線板、7…実装用パッド、19…印、3 7…ダミーパッド、L1…第1のレーザー光、L2…第2のレーザー光、L…レーザー光、A-A1…照射面。



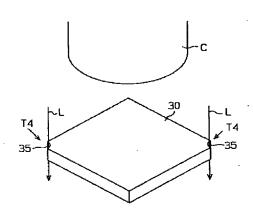
【図14】



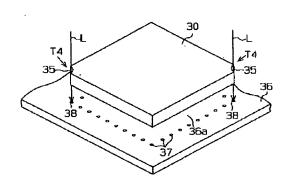
【図16】



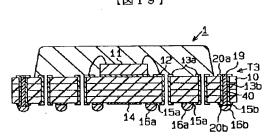
【図17】



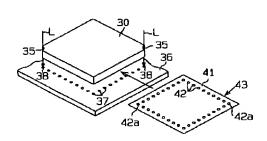
【図18】



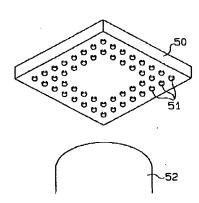
【図19】



[図20]



[図21]



【図22】

